

## Parametry techniczne

L.p.	Parametry charakteryzujące zamawiany sprzęt uwzględniany przy technicznej ocenie oferty	Punktacja
1	Zakres analizy ilościowej pierwiastków: 2 pkt. za każdy pierwiastek lżejszy od Al	0 do 20
2	Dodatkowa baza danych krystalograficznych <i>Crystal Impact</i> , (licencja na 2 stanowiska) kompatybilna z oprogramowaniem toru pomiarowego	0 lub 5
3	Wielkość obszaru mapowania powierzchni próbki: $\text{Liczba punktów} = (O_{\text{bad}} - O_{\text{min}}) / (O_{\text{max}} - O_{\text{min}}) \times 25$ gdzie: — $O_{\text{bad}}$ – obszar podany w ofercie badanej — $O_{\text{min}}$ – obszar najmniejszy spośród wszystkich ofert — $O_{\text{max}}$ – obszar największy spośród wszystkich ofert <u>Uwaga:</u> W przypadku złożenia tylko jednej oferty, przyznawana liczba punktów = 25.	0 do 25
4	Rozdzielczość mapowania powierzchni próbki $\text{Liczba punktów} = (R_{\text{bad}} - R_{\text{min}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{min}}) \times 20$ gdzie: — $R_{\text{bad}}$ – rozdzielczość podana w ofercie badanej — $R_{\text{min}}$ – rozdzielczość najgorsza spośród wszystkich ofert — $R_{\text{max}}$ – rozdzielczość najlepsza spośród wszystkich ofert <u>Uwaga:</u> W przypadku złożenia tylko jednej oferty, przyznawana liczba punktów = 20.	0 do 20
5	Baza danych (punktowana data ważności licencji): za okres krótszy niż 18 m-cy – 0 pkt., od 18 m-cy do 24 m-cy - 2 pkt., 24 m-cy do 28 m-cy – 3 pkt., 28 m-cy do 32 m-cy - 4 pkt., 32 m-cy i dłużej - 5 pkt.	0 do 5



DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

	Parametry układu do analizy fazowej:	
	a) rozdzielczość w skali $2\theta$ :	
6	— $\Delta 2\theta \geq 0.05^\circ = 5$ pkt. — $\Delta 2\theta \geq 0.005^\circ = 10$ pkt. — $\Delta 2\theta < 0.005^\circ = 15$ pkt.	0 do 15
	Dodatkowe koszty eksploatacji:	
7	— konieczność stosowania gazu w detektorze i wody chłodzącej = 0 pkt. — konieczność stosowania gazu w detektorze = 5 pkt. — konieczność stosowania wody chłodzącej = 5 pkt. — eksploatacja nie wymagająca stosowania gazu w detektorze i wody chłodzącej = 10 pkt.	0 do 10

DOSTOSOWANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO IMIM PAN DO WYMAGAŃ ŚWIATOWYCH STANDARDÓW  
KOMPLEMENTARNYCH BADAŃ W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ